

### **A theoretically accurate mobility model for semiconductor device drift-diffusion simulation**

**Velmre, Enn; Udal, Andres;** Kocsis, T.; Masszi, F. Physica scripta 1994 / p. 263-267 <https://doi.org/10.1088/0031-8949/1994/T54/064>

### **Ab initio study of GaN properties using VASP software package**

**Klopov, Mihhail;** Kuusk, Ahto; **Velmre, Enn; Udal, Andres** BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia 2004 / p. 55-58 : ill

### **Advances in terahertz technology with emphasis on quantum cascade lasers**

**Reeder, Reeno; Velmre, Enn; Udal, Andres** Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering 2010 / p. 47-50 : ill <https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/9225>

### **Ambipolar diffusion in a three-carrier semiconductor plasma**

**Velmre, Enn;** Masszi, F. Program of 17th Nordic Semiconductor Meeting, Trondheim, Norway, June 17-20, 1996 1996 / p. 36

### **Apparent decrease of diffusion coefficients due to the plasma-induced band gap narrowing**

**Udal, Andres; Velmre, Enn** 19th Nordic Semiconductor Meeting : May 20-23, 2001, Copenhagen, Denmark : abstracts 2001 / p. 22 : ill

### **A brief survey of exciton concentration models for Si**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** The 7th Biennial Conference on Electronics and Microsystem Technology "Baltic Electronics Conference" : BEC 2000 : October 8 - 11, 2000, Tallinn, Estonia : conference proceedings 2000 / p. 19-22 : ill

### **[Christou, A. Integrating reliability into microelectronics manufacturing. Series on design and measurement in electronic engineering, edited by D.V.Morgan and H.L.Grubin. Wiley, Chichester, 1994. 349 p. : Book review]**

**Velmre, Enn** Engineering applications of artificial intelligence 1996 / p. 97 [https://www.ester.ee/record=b1200126\\*est](https://www.ester.ee/record=b1200126*est)

### **Comparison of methods for solving the Schrödinger equation for multiquantum well heterostructure applications**

**Udal, Andres; Reeder, Reeno; Velmre, Enn;** Harrison, Paul Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering = Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Tehnikateadused 2006 / p. 246-261 : ill [https://www.ester.ee/record=b1072102\\*est](https://www.ester.ee/record=b1072102*est)

### **Comparison of photon recycling effect in GaAs and GaN structures**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering = Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Tehnikateadused 2004 / p. 157-172 : ill [https://www.ester.ee/record=b1072102\\*est](https://www.ester.ee/record=b1072102*est)

### **Comparison of Si and SiC devices surge current capability by means of numerical simulations**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** BEC'96 : the 5th Biennial Baltic Electronics Conference, October 7-11, 1996, Tallinn, Estonia : proceedings 1996 / p. 77-80: ill

### **Comparison of uncertainty relations in quantum mechanics and signal processing**

**Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn; Klopov, Mihhail** 11th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations and 4th Feynman Festival : June 22-26, 2009, Olomouc, Czech Republic : book of abstracts 2009 / p. 135-136 [https://jointlab.upol.cz/icssur2009/doc/bookabs\\_2nded.pdf](https://jointlab.upol.cz/icssur2009/doc/bookabs_2nded.pdf)

### **Comparison of uncertainty relations in quantum mechanics and signal processing [Electronic resource]**

**Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn; Klopov, Mihhail** 11th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations and 4th Feynman Festival : Olomouc, Czech Republic, June 22-26, 2009 : conference proceedings 2009 / [16] p. [DVD]

### **Computer-aided analysis of the GTO thyristor current squeezing effect**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Automation, simulation & measurement : 3rd biennial conference : Tallinn, Estonia, October 7-11, 1991. Section S, Simulation = Automatiseerimine, modelleerimine ja mõõtmine : 3. rahvusvaheline konverents / Tallinna Tehnikaülikool 1992 / p. 159-171: ill [https://www.ester.ee/record=b1064031\\*est](https://www.ester.ee/record=b1064031*est)

### **Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Physica scripta 1999 / p. 193-197 : ill <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999PhST...79..193V/abstract> <http://doi.org/10.1238/Physica.Topical.079a00193>

### **Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** 18th Nordic Semiconductor Meeting, Linköping, June 7-10, 1998 : abstracts 1998 / p. F-88: ill <https://iopscience.iop.org/article/10.1238/Physica.Topical.079a00193>

### **Critical analysis of uncertainty relations based on signal duration and spectrum width**

**Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn** Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering 2009 / p. 31-34 : ill [https://www.ester.ee/record=b1200105\\*est](https://www.ester.ee/record=b1200105*est) <https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10098>

### **Development and optimisation of modelling methods and algorithms for terahertz range radiation sources based on**

**quantum well heterostructures = Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertsikiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine**

**Reeder, Reeno** 2014 [https://www.ester.ee/record=b3084247\\*est](https://www.ester.ee/record=b3084247*est)

**Development of numerical semiconductor device models and their application in device theory and design**

**Udal, Andres** 1998 [http://www.ester.ee/record=b1158907\\*est](http://www.ester.ee/record=b1158907*est)

**Development of quantum cascade laser simulation software**

**Udal, Andres; Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; Velmre, Enn** BEC 2012 : 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-5, 2012, Tallinn, Estonia 2012 / p. 47-48 : ill [https://www.ester.ee/record=b2150914\\*est](https://www.ester.ee/record=b2150914*est)

**Discussion of the development aspects of the quantum cascadelaser simulation software**

**Reeder, Reeno; Udal, Andres; Velmre, Enn** International Conference on THz and Mid Infrared Radiation and Applications to Cancer Detection Using Laser Imaging jointly with the Workgroup Meetings of Cost Actions MP1204 and BM1205 : October 10-11, 2013, Sheffield, United Kingdom 2013 / p. [36] <http://tera-mir.org/main/node/60>

**Eesti kingitus maailma füüsikale : 9. aprillil möödus 237 aastat Thomas Johann Seebecki sünnist Tallinnas : [intervjuu prof. Enn Velmre ja prof. Mart Min'iga]**

**Velmre, Enn; Min, Mart** Mente et Manu 2007 / 18. apr., lk. 3 : ill [https://www.ester.ee/record=b1242496\\*est](https://www.ester.ee/record=b1242496*est)

**Efficiency estimation for a broadband 7 THz radiation source with GaAs/AlGaAs parabolic quantum wells**

**Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; Udal, Andres; Velmre, Enn** The proceedings of the Ninth International Conference on Intersubband Transitions in Quantum Wells : Ambleside, Cumbria, U.K., 9-14th September 2007 2007 / p. P67-2 : ill [https://www.academia.edu/63544688/Efficiency\\_Estimation\\_for\\_a\\_Broadband\\_7\\_THz\\_Radiation\\_Source\\_with\\_GaAs\\_AlGaAs\\_Parabolic\\_Quantum\\_Wells](https://www.academia.edu/63544688/Efficiency_Estimation_for_a_Broadband_7_THz_Radiation_Source_with_GaAs_AlGaAs_Parabolic_Quantum_Wells)

**Electrothermal simulation of power semiconductor devices**

**Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres** Proceedings of the 1991 International Workshop on VLSI Process and Device Modeling, 26-27 May, 1991, Oiso, Kanagawa, Japan 1991 / p. 28-29

**Electro-thermal simulations and forward surge current failure prediction for SiC diodes**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Program of 17th Nordic Semiconductor Meeting, Trondheim, Norway, June 17-20, 1996 1996 / p. 28

**Elektronmäng**

**Velmre, Enn** ENEKE. 4. [köide], Suurk-Y. Sisujuht. Lisa : õpilase teatmeteos 1986 / lk. 240-241 [https://www.ester.ee/record=b1244551\\*est](https://www.ester.ee/record=b1244551*est)

**Elektrontechnika füüsikalised alused : laboratoorsete tööde juhendid ja harjutusülesanded**

1981 [https://www.ester.ee/record=b1317817\\*est](https://www.ester.ee/record=b1317817*est)

**Elektroonika**

**Velmre, Enn** TEA entsüklopeedia. 6. köide, eerika - faiaagid 2011 / lk. 199

**Elektroonika desintegratsioon**

**Velmre, Enn** Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2002 2003 / lk. 33-38 [https://www.ester.ee/record=b1212786\\*est](https://www.ester.ee/record=b1212786*est)

**The experimental results of reverse recovery effects in power fastrecovery diodes analyzed by numerical model**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Vaher, G.T.; Tarma, Mati** Proceedings International AEGEAN Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Kusadasi 27-29 May, 1992 1992 / p. 738-743: fig

**Failure prediction of power devices under reverse surge current conditions**

**Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres** ISPSD'92 : Proceedings of the 4th International Symposium on Power Semiconductor Devices & Ics, Waseda University, Tokyo, Japan, 19-21 May 1992 1992 / p. 118-123 : ill <https://doi.org/10.1109/ISPSD.1992.991247>

**Filter**

**Velmre, Enn** TEA entsüklopeedia. 7. köide, Faial - Haamer 2011 / lk. 61-62 [https://www.ester.ee/record=b2712813\\*est](https://www.ester.ee/record=b2712813*est)

**40 years of Electronics Department at Tallinn Technical University**

**Tamm, Uljas; Velmre, Enn** BEC 2002 : proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference : October 6-9, 2002, Tallinn, Estonia 2002 / p. 7-10 [https://www.ester.ee/record=b2150914\\*est](https://www.ester.ee/record=b2150914*est)

**GIGA - power semiconductor devices simulation software**

**Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres** The Bug Exterminator (USA). Special issue, Santa Clara 1990 / p. 1-16: fig

**High phonon-drag thermoelectric efficiency of SiC at low temperatures**

**Velmre, Enn; Udal, Andres;** Grivickas, Vytautas Final program of the 10th International Conference on SiC and Related Materials : ICSCRM'2003 : Lyon, France, Oct. 5-10, 2003 2003 / p. ThP4-13 [https://www.researchgate.net/publication/240834700\\_High\\_Phonon-Drag\\_Thermoelectric\\_Efficiency\\_of\\_SiC\\_at\\_Low\\_Temperatures](https://www.researchgate.net/publication/240834700_High_Phonon-Drag_Thermoelectric_Efficiency_of_SiC_at_Low_Temperatures)

**Impact of phonon drag effect on Seebeck coefficient in p-6H-SiC : experiment and simulation**

Bikbajevs, V.; Grivickas, Vytautas; Stölzer, M.; **Velmre, Enn; Udal, Andres;** Grivickas, Paulius; Syväjärvi, Mikael; Yakimova, Rositza Materials science forum 2003 / p. 407-410 <https://www.scientific.net/MSF.433-436.407>  
<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.433-436.407>

**Impact of phonon-drag effect on Seebeck coefficient in SiC : experiment and simulation**

Bikbajevs, V.; Grivickas, V.; Stölzer, M.; **Velmre, Enn; Udal, Andres;** Grivickas, Paulius; Syväjärvi, Mikael; Yakimova, Rositza Abstracts of the Lithuanian National Physics Conference : LNPK-34 : Vilnius, 2003 2003 / p. 219 <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A269444&dsid=8596>

**Influence of excitonic scattering on charge carrier ambipolar diffusion in silicon**

**Udal, Andres; Velmre, Enn** ESSDERC'97 : proceedings of the 27th European Solid-State Device Research Conference, Stuttgart, Germany, 22-24 September 1997 1997 / p. 212-215: ill <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1503333>

**Infotehnoloogia teaduskond**

**Gordon, Boris; Velmre, Enn; Einer, Lauri; Tamm, Uljas; Meister, Ants; Korsen, Viljo; Märten, Olev; Parve, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes; Min, Mart** Leiutajaid ja leiutisi Tallinna Tehnikaülikoolis 1922-2007 2008 / lk. 34-47 : ill [https://www.ester.ee/record=b2412718\\*est](https://www.ester.ee/record=b2412718*est)

**Integraallülitus**

**Velmre, Enn** TEA entsüklopeedia. 9. köide, indeen - Kallak 2012 / lk. 59-60 [https://www.ester.ee/record=b2869027\\*est](https://www.ester.ee/record=b2869027*est)

**Investigation of charge carrier lifetime temperature-dependence in 4H-SiC diodes**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Silicon carbide and related materials 2006 2007 / p. 375-378  
[https://www.researchgate.net/publication/250348987\\_Investigation\\_of\\_Charge\\_Carrier\\_Lifetime\\_Temperature-Dependence\\_in\\_4H-SiC\\_Diodes](https://www.researchgate.net/publication/250348987_Investigation_of_Charge_Carrier_Lifetime_Temperature-Dependence_in_4H-SiC_Diodes)

**Investigation of silicon carbide diode structures via numerical simulations including anisotropic effects**

**Velmre, Enn; Udal, Andres;** Masszi, F.; Nordlander, E. Simulation of semiconductor devices and processes. Vol. 6 1995 / p. 340-343: ill [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-6619-2\\_83](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-6619-2_83)

**Iooneadise**

**Velmre, Enn** TEA entsüklopeedia. 9. köide, indeen - Kallak 2012 / lk. 73 [https://www.ester.ee/record=b2869027\\*est](https://www.ester.ee/record=b2869027*est)

**Jaapani professor esines Tallinna Tehnikaülikoolis : [Tohoku Ülikooli prorektor ja biomeditsiinielektronika labori juhataja Nozomu Hoshimiya]**

**Min, Mart; Velmre, Enn** Mente et Manu 2001 / lk. 3 : portr [https://www.ester.ee/record=b1242496\\*est](https://www.ester.ee/record=b1242496*est)

**Jõupooljuhtseadiste numbrilise modelleerimise alased tööd TPI-s**

**Velmre, Enn** Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis 1988 / lk. 128-143

**Jõupooljuhtseadiste numbriliste mudelite väljatöötamine ja rakendamine : ainevaldkond : elektrotehnika : magistritöö**

**Udal, Andres** 1992 [http://www.ester.ee/record=b2630327\\*est](http://www.ester.ee/record=b2630327*est)

**Kui vana on elektroonika?**

**Velmre, Enn** Elektroonika 2004 : XI rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid 2004 / lk. 53-56  
[https://www.ester.ee/record=b1910557\\*est](https://www.ester.ee/record=b1910557*est)

**Kui vana on elektroonika? : ettekanne rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverentsil "Elektroonika 2004" 14. mail 2004 TTÜs**

**Velmre, Enn** Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004 2005 / lk. 291-296 : ill [https://www.ester.ee/record=b1212786\\*est](https://www.ester.ee/record=b1212786*est)

**Kuulsa füüsiku mälestusmärk TTÜ linnakus : [Thomas Johann Seebecki mälestusmärgi avamine 24. mail 2013]**

**Velmre, Enn** Mente et Manu 2013 / lk. 18 : fot [https://www.ester.ee/record=b1242496\\*est](https://www.ester.ee/record=b1242496*est)

**Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis**

**Kulbach, Valdek; Hinrikus, Hiie; Järvi, Jaan; Kanasaar, Eduard; Kilk, Aleksander; Metusala, Tiit; Mägi, Vahur; Tamm, Uljas; Tapupere, Olev; Tiismus, Hugo; Ubar, Raimund-Johannes; Velmre, Enn** 1988 [https://www.ester.ee/record=b1243393\\*est](https://www.ester.ee/record=b1243393*est)

**Lambid, transistorid või ...?**

**Velmre, Enn** Tallinna Polütehnik 1972 / lk. 3 [https://www.ester.ee/record=b1254708\\*est](https://www.ester.ee/record=b1254708*est)

**Laterally pumped GaAs/AlGaAs quantum wells as sources of broadband terahertz radiation**

**Reeder, Reeno;** Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; **Udal, Andres; Velmre, Enn** Journal of applied physics 2007 / [6] p. : ill  
<https://pubs.aip.org/aip/jap/article/102/7/073715/987937/Laterally-pumped-GaAs-AlGaAs-quantum-wells-as> <https://doi.org/10.1063/1.2783779>

#### **Measurement of charge carrier lifetime temperature dependence in 4H-SiC power diodes**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Abstracts of International Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ICSCRM'99 : October 10-15, 1999, Research Triangle Park, North-Carolina, USA 1999 / paper no 394, 2 p  
[https://www.researchgate.net/publication/240833834\\_Measurement\\_of\\_Charge\\_Carrier\\_Lifetime\\_Temperature-Dependence\\_in\\_4H-SiC\\_Power\\_Diodes](https://www.researchgate.net/publication/240833834_Measurement_of_Charge_Carrier_Lifetime_Temperature-Dependence_in_4H-SiC_Power_Diodes)

#### **Measurement of charge carrier lifetime temperature-dependence in 4H-SiC power diodes**

**Udal, Andres; Velmre, Enn** Proceedings of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials - 1999 (ICSCRM'99) : Research Triangle Park, North-Carolina, USA, Oct. 10-15, 1999. Vol. 1 2000 / p. 781-784  
<https://www.scientific.net/MSF.338-342.781>

#### **Modeling and simulation of bipolar semiconductor devices : authors's main publications**

**Velmre, Enn** 1996 [http://www.ester.ee/record=b2079366\\*est](http://www.ester.ee/record=b2079366*est)

#### **Modeling in semiconductor electronics**

**Velmre, Enn; Rang, Toomas** BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 501-516: ill [https://www.ester.ee/record=b2150914\\*est](https://www.ester.ee/record=b2150914*est)

#### **Modeling in semiconductor electronics**

Javor, A.; **Rang, Toomas;** Szekely, V.; Tarnay, K.; **Velmre, Enn** 1993 [https://www.ester.ee/record=b1031052\\*est](https://www.ester.ee/record=b1031052*est)

#### **Modeling of a carbon nanotube junction with ab-initio software VASP**

**Velmre, Enn; Klopov, Mihhail; Udal, Andres** BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 75-78 : ill

#### **Modeling of charge carrier non-isothermal transport parameters in silicon**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** BEC'98 : the 6th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology, October 7-9, 1998, Tallinn, Estonia : proceedings 1998 / p. 71-74: ill

#### **Modeling of lattice heat conductivity and thermopower in SiC considering the four-phonon scattering processes**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Material science forum 2003 / p. 391-394 <https://www.scientific.net/MSF.433-436.391>

#### **Modeling of photon recycling in GaN-devices**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Klopov, Mihhail** Material Science Forum. 483/485 2005 / p. 1039-1042  
[https://www.researchgate.net/publication/250344144\\_Modeling\\_of\\_Photon\\_Recycling\\_in\\_GaN-Devices](https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices)

#### **Modeling of photon recycling in GaN-devices**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Klopov, Mihhail** 5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : book of abstracts : 31 August-4 September 2004, Bologna, Italy 2004 / p. 317-318  
[https://www.researchgate.net/publication/250344144\\_Modeling\\_of\\_Photon\\_Recycling\\_in\\_GaN-Devices](https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices)

#### **Modeling of photon recycling in GaN-devices**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Klopov, Mihhail** Silicon carbide and related materials 2004 : ECSCRM 2004 : proceedings of the 5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, August 31-September 4, 2004, Bologna, Italy 2005 / p. 1039-1042 : ill [https://www.researchgate.net/publication/250344144\\_Modeling\\_of\\_Photon\\_Recycling\\_in\\_GaN-Devices](https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices)

#### **Modelling of charge carrier non-isothermal transport in silicon and silicon carbide**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2000 / p. 144-154 : ill  
[https://artiklid.elnet.ee/record=b1004044\\*est](https://artiklid.elnet.ee/record=b1004044*est)

#### **Nanotehnoloogiad : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms**

2011 [https://www.ester.ee/record=b2707940\\*est](https://www.ester.ee/record=b2707940*est)

#### **Nanotehnoloogiad : sõnastik. Osa 3, Süsinik-nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 3, Carbon nano-objects**

2011 [https://www.ester.ee/record=b2707947\\*est](https://www.ester.ee/record=b2707947*est)

#### **Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms (ISO/TS 80004-1:2015)**

2016 [http://www.ester.ee/record=b4601747\\*est](http://www.ester.ee/record=b4601747*est)

#### **Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 2, Nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 2, Nano-objects**

(ISO/TS 80004-2:2015)

2017 [https://www.ester.ee/record=b4697338\\*est](https://www.ester.ee/record=b4697338*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 3, Süsinik-nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 3, Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010)**

2015 [http://www.ester.ee/record=b4454176\\*est](http://www.ester.ee/record=b4454176*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 4, Nanostruktuur-materjalid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 4, Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)**

2015 [http://www.ester.ee/record=b4454176\\*est](http://www.ester.ee/record=b4454176*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 4, Nanostruktuur-materjalid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 4, Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)**

2013 [https://www.ester.ee/record=b4459478\\*est](https://www.ester.ee/record=b4459478*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 6, Nanoobjektide karakteriseerimine = Nanotechnologies : vocabulary. Part 6, Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)**

2015 [http://www.ester.ee/record=b4457416\\*est](http://www.ester.ee/record=b4457416*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 6, Nanoobjektide karakteriseerimine = Nanotechnologies : vocabulary. Part 6, Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)**

2015 [http://www.ester.ee/record=b4483533\\*est](http://www.ester.ee/record=b4483533*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 8, Nanootootmisprotsessid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 8, Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2013)**

2015 [http://www.ester.ee/record=b4531230\\*est](http://www.ester.ee/record=b4531230*est)

**Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms (ISO/TS 80004-1:2010)**

2015 [http://www.ester.ee/record=b4454097\\*est](http://www.ester.ee/record=b4454097*est)

**Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt**

**Velmre, Enn** Elektriala 2005 / lk. 22-24 : ill

**Nonisothermal numerical simulation of semiconductor power devices**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Automation, simulation & measurement : 3rd biennial conference : Tallinn, Estonia, October 7-11, 1991.

Section S, Simulation = Automatiseerimine, modelleerimine ja mõõtmine : 3. rahvusvaheline konverents / Tallinna Tehnikaülikool

1992 / p. 139-145: ill [https://www.ester.ee/record=b1064031\\*est](https://www.ester.ee/record=b1064031*est)

**Numerical analysis of forward-biased diode structures based on direct-gap semiconductors**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Electronics letters : an international publication 1979 / p. 383-385

[https://www.ester.ee/record=b2180432\\*est](https://www.ester.ee/record=b2180432*est)

**Numerical analysis of the on-state of diode structures based on direct-gap semiconductors**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres** Physica scripta : an international journal for experimental and theoretical physics 1981 /

p. 468-471 : ill [https://www.ester.ee/record=b2244094\\*est](https://www.ester.ee/record=b2244094*est) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/24/2/026/pdf>

**Numerical aspects of the development of quantum cascade laser simulation software**

**Reeder, Reeno; Udal, Andres; Velmre, Enn; Valavanis, Alexander** BEC 2014 : 2014 14th Biennial Baltic Electronics Conference :

proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 6-8, 2014, Tallinn, Estonia

2014 / p. 37-40 : ill

**Numerical investigation of digitised parabolic quantum wells for terahertz AlGaAs/GaAs structures**

**Reeder, Reeno; Udal, Andres; Velmre, Enn; Harrison, Paul** BEC 2006 : 2006 International Baltic Electronics Conference : Tallinn

University of Technology, October 2-4, 2006, Tallinn, Estonia : proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference 2006 /

p. 51-54 : ill

**Numerical investigation of SiC devices performance considering the incomplete dopant ionization**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Silicon carbide and related materials 2005 2006 / p. 1383-1386 [https://www.scientific.net/MSF.527-](https://www.scientific.net/MSF.527-529.1383)

[529.1383](https://www.scientific.net/MSF.527-529.1383)

**Numerical modeling of the electrothermal transient process in diode structures based on direct-gap semiconductors**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Physica status solidi. A, Applied research 1983 / p. K131-K134 [https://www.ester.ee/record=b1562026\\*est](https://www.ester.ee/record=b1562026*est)

**Numerical simulation of a forward-based p-i-n structure with band-to-band Auger recombination**

**Freidin, Boris; Velmre, Enn** Electronics letters : an international publication 1978 / p. 701-703

[https://www.ester.ee/record=b2180432\\*est](https://www.ester.ee/record=b2180432*est)

#### **Numerical simulation of a silicon carbide diode**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 559-566: ill [https://www.ester.ee/record=b2150914\\*est](https://www.ester.ee/record=b2150914*est)

#### **Numerical simulation of electrothermal effects in ESD protection devices**

Hellström, Sven; **Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres** ESREF'92: 3rd European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis : 5-8 October 1992, Schwäbisch Gmünd, Germany : conference proceedings 1992 / p. 77-80 <https://d-nb.info/921228503/04>

#### **Numerical simulation of electrothermal interactions in semiconductor devices experiencing ESD pulses**

**Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres** Techn. Dig. of International Workshop on Computational Electronics, 1992 May 28-29, Beckman Institute, Univ. of Illinois Urbana-Champaign, USA 1992 / p. 75-78 : ill [https://in4.iue.tuwien.ac.at/pdfs/iwce/iwce1\\_1992/pdfs/pp075-078.pdf](https://in4.iue.tuwien.ac.at/pdfs/iwce/iwce1_1992/pdfs/pp075-078.pdf)

#### **Pooljuhid läbi aegade**

**Velmre, Enn** Horisont 1974 / lk. 15-19 : ill.; 7 lk. 26-28 : ill.; 9 lk. 24-27 <https://www.digar.ee/arhiiv/et/periodika/69737>  
<https://www.digar.ee/arhiiv/et/periodika/69744> [https://www.ester.ee/record=b1072243\\*est](https://www.ester.ee/record=b1072243*est) <https://www.digar.ee/arhiiv/et/periodika/69745>

#### **Pooljuhtseadis**

**Velmre, Enn** ENEKE, 3. [kd.], Mol - Suurj. : õpilase teatmeteos 1984 / lk. 147 : ill [https://www.ester.ee/record=b1339899\\*est](https://www.ester.ee/record=b1339899*est)

#### **Power diode transient characteristics modeling in inductive load circuits**

**Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres** The Bug Exterminator (USA) 1991 / p. 1-5: fig

#### **Quantum mechanical transforms between x- and k-space as a signal processing problem**

**Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn; Klopov, Mihhail** BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 71-74 : ill [https://www.ester.ee/record=b2150914\\*est](https://www.ester.ee/record=b2150914*est)

#### **Raamatu tekkeloost : [Velmre, E. ; (toim.) Kello, K. Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831. Tallinn : Argo, 2022]**

**Velmre, Enn** Elektriala 2022 / lk. 27 : portr [https://www.ester.ee/record=b1240496\\*est](https://www.ester.ee/record=b1240496*est)

#### **Saateks**

**Velmre, Enn** Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831 2022 / lk. 13-17 [https://www.ester.ee/record=b5519213\\*est](https://www.ester.ee/record=b5519213*est)

#### **SiC-diodes forward surge current failure mechanisms : experiment and simulation**

**Udal, Andres; Velmre, Enn** Microelectronics reliability 1997 / p. 1671-1674 [https://doi.org/10.1016/S0026-2714\(97\)00136-4](https://doi.org/10.1016/S0026-2714(97)00136-4)

#### **SiC-diodes forward surge current failure mechanisms : experiment and simulation**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** ESREF'97 : proceedings of the 8th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, Oct. 7-10, 1997, Bordeaux, France 1997 / p. 1671-1674 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026271497001364>

#### **Study of radiative recombination influence in GaN and GaAs bipolar transistor structures**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Verbitski, Irina** BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia 2004 / p. 59-62 : ill

#### **Tallinna kaupmehe pojast füüsikaklassikuks. Thomas Johann Seebeck (1770-1831)**

**Velmre, Enn** Vana Tallinn. XXIII (XXVII) 2012 / lk. 274-286 : ill [https://artiklid.elnet.ee/record=b2538155\\*est](https://artiklid.elnet.ee/record=b2538155*est)

#### **Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831**

**Velmre, Enn** 2022 [https://www.ester.ee/record=b5519213\\*est](https://www.ester.ee/record=b5519213*est)

#### **Tallinnast võrsunud avastaja**

**Velmre, Enn** Horisont 1971 / lk. 44-47 [https://www.ester.ee/record=b1072243\\*est](https://www.ester.ee/record=b1072243*est)

#### **TEA entsüklopeedia**

2012 [https://www.ester.ee/record=b2869027\\*est](https://www.ester.ee/record=b2869027*est)

#### **TEA entsüklopeedia**

2011 [https://www.ester.ee/record=b2666688\\*est](https://www.ester.ee/record=b2666688*est)

## TEA entsüklopeedia

2011 [https://www.ester.ee/record=b2712813\\*est](https://www.ester.ee/record=b2712813*est)

**Termoelektri avastaja Thomas Johann Seebeck : [ettekanne rahvusvahelisel seminaril 11. mail 2007 TTÜs]**  
**Velmre, Enn** Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2007 2008 / lk. 335-339

**A theoretical study of electron drift mobility anisotropy in n-type 4H- and 6H-SiC**  
**Velmre, Enn; Udal, Andres** Materials science forum 2000 / p. 725-728

**A theoretical study of electron drift mobility anisotropy in n-type 4H- and 6H-SiC**  
**Velmre, Enn; Udal, Andres** Abstracts of International Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ICSCRM'99 : October 10-15, 1999, Research Triangle Park, North-Carolina, USA 1999 / paper no 395, 2 p  
[https://www.researchgate.net/publication/250338907\\_A\\_Theoretical\\_Study\\_of\\_Electron\\_Drift\\_Mobility\\_Anisotropy\\_in\\_n-Type\\_4H-and\\_6H-SiC](https://www.researchgate.net/publication/250338907_A_Theoretical_Study_of_Electron_Drift_Mobility_Anisotropy_in_n-Type_4H-and_6H-SiC)

**A theoretically accurate mobility model for drift-diffusion power device simulation**  
**Velmre, Enn; Udal, Andres; Kocsis, T.; Masszi, F.** 16th Nordic Semiconductor Meeting, Laugarvatn, Iceland, June 12-15, 1994 : abstracts 1994 / p. 92

**Thermopower measurements in 4H-SiC and Theoretical calculations considering the phonon drag effect**  
Grivickas, V.; Stölzer, M.; **Velmre, Enn; Udal, Andres**; Grivickas, P.; Syväjärvi, M.; Yakimova, R.; Bikbajevs, V. Abstracts of the 3rd European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ECSCRM'2000 : Sept. 3-7, 2000, Kloster Banz, Germany 2000 / p. 144

**Thermopower measurements in 4H-SiC and theoretical calculations considering the phonon drag effect**  
Grivickas, Vytautas; Stölzer, M.; **Velmre, Enn; Udal, Andres**; Grivickas, Paulius; Syväjärvi, Mikael; Yakimova, Rositza; Bikbajevs, V. Silicon Carbide and Related Materials : ECSCRM2000 : proceedings of the 3rd European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : Kloster Banz, Germany, September 2000 2001 / p. 491-494 : ill  
[https://www.researchgate.net/publication/240833914\\_Thermopower\\_Measurements\\_in\\_4H-SiC\\_and\\_Theoretical\\_Calculations\\_Considering\\_the\\_Phonon\\_Drag\\_Effect](https://www.researchgate.net/publication/240833914_Thermopower_Measurements_in_4H-SiC_and_Theoretical_Calculations_Considering_the_Phonon_Drag_Effect)

**Thomas J. Seebeck 250 : tänased mikro- ja nanoelektronika lahendused toetuvad tuntumaile Eestis sündinud täppisteadlasele**  
**Härmä, Karin** Mente et Manu 2020 / lk. 64-65 : ill [https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM\\_01\\_2020/mobile/index.html](https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_01_2020/mobile/index.html)  
[https://www.ester.ee/record=b1242496\\*est](https://www.ester.ee/record=b1242496*est)

**Thomas J. Seebeck 250 : tänased mikro- ja nanoelektronika lahendused toetuvad tuntumaile Eestis sündinud täppisteadlasele**  
**Härmä, Karin** Elektriala 2020 / lk. 24-25 [http://www.ester.ee/record=b1240496\\*est](http://www.ester.ee/record=b1240496*est)

**Thomas Johann Seebeck : Vom Tallinner Kaufmannssohn zum Klassiker der Physik**  
**Velmre, Enn**; Glesner, Manfred; Hasselblatt, Cornelius; Müller-Harang, Ulrike 2025 <https://www.waterstones.com/book/thomas-johann-seebeck/enn-velmre/manfred-glesner/9783662719794>

**Thomas Johann Seebeck (1770-1831)**  
2007 [http://www.ester.ee/record=b2285820\\*est](http://www.ester.ee/record=b2285820*est)

**Thomas Johann Seebeck (1770-1831)**  
**Velmre, Enn** Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2007 / 4, p. 276-282

**Thomas Johann Seebeck and his contribution to the modern science and technology**  
**Velmre, Enn** BEC 2010 : 2010 12th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 4-6, 2010, Tallinn, Estonia 2010 / p. 17-24 : ill

**Thomas Johann Seebeck ja tema panus tänapäeva teadusesse ja tehnikasse**  
**Velmre, Enn** Elektriala 2019 / lk. 28-29 : ill; 4, lk. 30-31 : ill; 5, lk. 26-27 : fot [http://www.ester.ee/record=b1240496\\*est](http://www.ester.ee/record=b1240496*est)

**Tunne kolleegi. Enn Velmre : [intervjuu Enn Velmrega]**  
**Velmre, Enn; Rang, Toomas; Haldre, Eero; Oras, Anne; Min, Mart** Avaja 2003 / lk. 3 : fot

**Two-dimensional surge current modeling of packaged power devices**  
**Udal, Andres; Freidin, Boris; Velmre, Enn** The Bug Exterminator : a monthly publication of Silvaco International 1992 / p. 6-7

**Tööstuselektronika eriala üliõpilaste ankeetvaatluse tulemustest**  
**Velmre, Enn** Õppemetoodika küsimusi ; 13 1976 / lk. 72-74 [https://www.ester.ee/record=b1346720\\*est](https://www.ester.ee/record=b1346720*est)

**Uncovering some hidden pages in the life of Thomas Johann Seebeck**

**Velmre, Enn** Journal of thermoelectricity 2015 / p. 5-9 [http://jt-old.ite.cv.ua/jt/jt\\_2015\\_04\\_en.pdf](http://jt-old.ite.cv.ua/jt/jt_2015_04_en.pdf)

#### **Uuringuid jõupooljuhtelektroonika seadiste ja seadmete alalt**

**Velmre, Enn** Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi ettekannete teesid : Tallinn, 15.-16. oktoober 1986 1986 / lk. 129-132 [https://www.ester.ee/record=b1258828\\*est](https://www.ester.ee/record=b1258828*est)

#### **Velmre, Enn : engineering educator**

**Velmre, Enn** Who's Who In The World 2007. 24th Edition 2006 / p. 2636  
[https://archive.org/details/whoswhoinworld200000marq\\_24ed/page/n5/mode/2up](https://archive.org/details/whoswhoinworld200000marq_24ed/page/n5/mode/2up)

#### **Аналитико-численная модель для исследования стационарного непроводящего состояния силовых тиристорov**

**Velmre, Enn; Rang, Toomas** Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 57-67 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1288985\\*est](https://www.ester.ee/record=b1288985*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959>

#### **Влияние распределения времени жизни электронов и дырок на процесс обратного восстановления р+-n-n+-диодов**

**Velmre, Enn; Dermenži, Pantelei; Udal, Andres** Электротехника : научно-технический журнал 1984 / с. 47-51  
[https://www.ester.ee/record=b2164206\\*est](https://www.ester.ee/record=b2164206*est)

#### **Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1356516\\*est](https://www.ester.ee/record=b1356516*est)

#### **Гармоническая линеаризация широтно-импульсного модулятора второго рода**

**Velmre, Enn** Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 135-143 : илл  
[https://www.ester.ee/record=b2190624\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190624*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996>

#### **Зависимость подвижности электронов и дырок от температуры и концентрации примеси в кремнии**

**Rang, Toomas; Velmre, Enn** Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 115-120 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b2190987\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190987*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200>

#### **Измерение коэффициентов ударной ионизации в рп-переходах при очень низкой интенсивности размножения**

**Velmre, Enn; Pikkov, Mihhail** Машинное проектирование электронных устройств и систем 1989 / с. 3-19 : ил

#### **Использование четырехзондового метода для измерения различных параметров полупроводникового материала**

**Samolevski, B.; Korpen, J.; Velmre, Enn** XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 117 [https://www.ester.ee/record=b1306141\\*est](https://www.ester.ee/record=b1306141*est)

#### **Исследование лавинного пробоя р-n перехода**

**Rang, Toomas; Velmre, Enn** XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 118 [https://www.ester.ee/record=b1306141\\*est](https://www.ester.ee/record=b1306141*est)

#### **Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой областью**

**Vaher, G.; Velmre, Enn; Lumi, J.; Tarma, Mati; Udal, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1356516\\*est](https://www.ester.ee/record=b1356516*est)

#### **Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью**

**Vaher, G.; Velmre, Enn; Tarma, Mati** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1356516\\*est](https://www.ester.ee/record=b1356516*est)

#### **Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных электросварочных диодов**

**Vaher, G.; Velmre, Enn; Mäe, T.; Freidin, Boris** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1264428\\*est](https://www.ester.ee/record=b1264428*est)

#### **Исследование статических и динамических характеристик транзисторных широтно-импульсных стабилизаторов постоянного напряжения : автореферат ... кандидата технических наук (05.253)**

**Velmre, Enn** 1970 [https://www.ester.ee/record=b1522330\\*est](https://www.ester.ee/record=b1522330*est)

#### **Исследование устойчивости установившегося режима в системе с широтно-импульсной модуляцией второго рода**

**Velmre, Enn** Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 12 1974 / с. 51-62 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b2190668\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190668*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b94a1f-6879-4443-b6f2-322fd7e53d89>

**Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования силовых полупроводниковых структур в проводящем состоянии**

**Velmr, Enn; Udall, Andres; Freidin, Boris** Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1981 / с. 85-88 [https://www.ester.ee/record=b1291241\\*est](https://www.ester.ee/record=b1291241*est)

**К вопросу об эффективной длине диффузии носителей заряда в условиях перепоглощения рекомбинационного излучения**

**Velmr, Enn** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 32-33 [https://www.ester.ee/record=b1310801\\*est](https://www.ester.ee/record=b1310801*est)

**К расчету максимального напряжения переключения р-п-п-структуры**

**Velmr, Enn; Rang, Toomas** Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 121-126 : ил [https://www.ester.ee/record=b2190987\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190987*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200>

**К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых р-п-переходах**

**Vaher, G.; Velmr, Enn** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96 [https://www.ester.ee/record=b1273235\\*est](https://www.ester.ee/record=b1273235*est)

**К расчету отпирающего тока управления р-п-п-структуры**

**Nurste, Ivar; Velmr, Enn** Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 127-133 : ил [https://www.ester.ee/record=b2190987\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190987*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200>

**Лавинное размножение носителей в кремниевых арсенид-галлиевых и фосфидиндиевых дополнительных РН-переходах**

**Rang, Toomas; Velmr, Enn** Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1984 / с. 3-13 : ил [https://www.ester.ee/record=b1549179\\*est](https://www.ester.ee/record=b1549179*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/99cc4681-4aa3-466a-b6da-b76f575d0f1e>

**Лавинное размножение носителей заряда в дополнительных р-п-переходах**

**Velmr, Enn** Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 3-14 : ил [https://www.ester.ee/record=b1319172\\*est](https://www.ester.ee/record=b1319172*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

**Моделирование технологического процесса кремниевых силовых полупроводниковых приборов на ЭВМ**

**Rang, Toomas; Velmr, Enn** Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 107-112 : ил [https://www.ester.ee/record=b1328194\\*est](https://www.ester.ee/record=b1328194*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b>

**Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых диодов**

**Aškinazi, German; Velmr, Enn; Logussov, A.; Timofeev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V.** Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 : ил [https://www.ester.ee/record=b1264310\\*est](https://www.ester.ee/record=b1264310*est)

**О влиянии Оже-рекомбинации на прямую ветвь вольт-амперной характеристики силового полупроводникового диода**

**Velmr, Enn; Dorodnev, V.** Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 13 1975 / с. 85-91 : ил [https://www.ester.ee/record=b2190710\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190710*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-4bbb-9468-118f743cc87f>

**О влиянии электронно-упрочного рассеяния на коэффициент передачи лико микроэлектронного биполярного транзистора**

**Velmr, Enn; Udall, Andres** Математическое моделирование физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых приборах : тезисы докладов II всесоюзного совещания (г. Ярославль, сентябрь 1988 г.) 1988 / с. 40

**О развитии научно-исследовательского направления "Приборы и устройства силовой полупроводниковой электроники"**

**Velmr, Enn** Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской конференции : Таллин, 15-16 октября 1986 г 1986 / с. 136-139 [https://www.ester.ee/record=b1231513\\*est](https://www.ester.ee/record=b1231513*est)

**Об абсолютной устойчивости одного широтно-импульсных систем**

**Velmr, Enn** Приборы и системы автоматизации 1969 / с. 133-144 : ил [https://www.ester.ee/record=b1371445\\*est](https://www.ester.ee/record=b1371445*est) <https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:652051/423871/page/136>

**Обобщенные формулы для анализа лавинного умножения носителей заряда в рп-переходах**

**Velmr, Enn** Automation, simulation & measurement : 3rd biennial conference : Tallinn, Estonia, October 7-11, 1991. Section S, Simulation = Automatiseerimine, modelleerimine ja mõõtmine : 3. rahvusvaheline konverents / Tallinna Tehnikaülikool 1992 / с. 172-183 : ил [https://www.ester.ee/record=b1064031\\*est](https://www.ester.ee/record=b1064031*est)

### **Определение параметров рекомбинационных центров из измерений вольт-амперных характеристик р-п-перехода**

**Velmre, Enn** Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 8 [https://www.ester.ee/record=b1322122\\*est](https://www.ester.ee/record=b1322122*est)

### **Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения**

**Velmre, Enn** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 [https://www.ester.ee/record=b1262177\\*est](https://www.ester.ee/record=b1262177*est)

### **Приближенный расчет коэффициента переноса носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения**

**Velmre, Enn** Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / lk. 87-94 [https://www.ester.ee/record=b1264310\\*est](https://www.ester.ee/record=b1264310*est)

### **Применение интерполяционных кубических сплайнов при решении уравнения диффузии с учетом перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения**

**Velmre, Enn** Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 51-55 [https://www.ester.ee/record=b1288985\\*est](https://www.ester.ee/record=b1288985*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959>

### **Применение численных моделей для усовершенствования технологии производства силовых полупроводниковых приборов**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris** Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые методы и технологии микроминиатюрных элементов : сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

### **Применение численных моделей при разработке полупроводниковых приборов и технологии их изготовления**

**Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris** Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

### **Прогнозирование величины ударного тока при одномерном численном моделировании силовых полупроводниковых структур**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Kõide I 1989 / с. 157-160 : ил [https://www.ester.ee/record=b1272248\\*est](https://www.ester.ee/record=b1272248*est)

### **Программа "Динамит-1" для одномерного численного моделирования тиристорных структур**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 59-63 : ил [https://www.ester.ee/record=b1591355\\*est](https://www.ester.ee/record=b1591355*est)

### **Расчет коэффициента лавинного размножения резких кремниевых р-п-переходов**

**Velmre, Enn** Acta polytechnica. řada 4, Technicko-teoreticka = Acta polytechnica. serija 4, Teoretičeskaja = Acta polytechnica. series 4, Theoretical studies = Acta polytechnica. Reihe 4, Theoretische Reihe = Acta polytechnica. série 4, Théorique 1975 / с. 117-122

### **Расчет коэффициента переноса неосновных носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения**

**Velmre, Enn** Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва, 24-26 ноября 1982 г 1982 / с. 25 [https://www.ester.ee/record=b1304403\\*est](https://www.ester.ee/record=b1304403*est)

### **Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах**

**Vaher, G.; Velmre, Enn** Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 49 [https://www.ester.ee/record=b1313776\\*est](https://www.ester.ee/record=b1313776*est)

### **Расчет показателя степени в формуле Миллера**

**Velmre, Enn** Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 145-154 : илл [https://www.ester.ee/record=b2190624\\*est](https://www.ester.ee/record=b2190624*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996>

### **Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 [https://www.ester.ee/record=b1310801\\*est](https://www.ester.ee/record=b1310801*est)

#### **Статистические характеристики импульсных стабилизаторов постоянного напряжения**

**Velmre, Enn** Технические средства и системы автоматики : [сборник статей] 1969 / с. ? [https://www.ester.ee/record=b2083958\\*est](https://www.ester.ee/record=b2083958*est)

#### **Физические аспекты учета влияния эффекта электронно-дырочного рассеяния при математическом моделировании полупроводниковых структур**

**Velmre, Enn** Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 166-174 : ил

#### **Численное моделирование напряженности электрического поля и напряжения пробоя в полупроводниковой структуре с двойной фаской**

**Velmre, Enn; Kuusik, E.; Tergem, Ilmar** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 50-58 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1264428\\*est](https://www.ester.ee/record=b1264428*est)

#### **Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 [https://www.ester.ee/record=b2768571\\*est](https://www.ester.ee/record=b2768571*est)

#### **Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах при большой плотности прямого тока**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1989 / с. 80-82 [https://www.ester.ee/record=b2768571\\*est](https://www.ester.ee/record=b2768571*est)

#### **Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах при воздействии мощного импульса прямого тока**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1983 / с. 73-76 : ил [https://www.ester.ee/record=b1291241\\*est](https://www.ester.ee/record=b1291241*est)

#### **Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 [https://www.ester.ee/record=b2768571\\*est](https://www.ester.ee/record=b2768571*est)

#### **Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур**

**Velmre, Enn; Udai, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1356516\\*est](https://www.ester.ee/record=b1356516*est)

#### **Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через многозарядные центры**

**Velmre, Enn; Opotski, Aleksei; Udai, Andres** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 : ил [https://www.ester.ee/record=b1273986\\*est](https://www.ester.ee/record=b1273986*est)

#### **Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного полупроводника**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей / Научно-исследовательский институт Производственного объединения "Таллинский электротехнический завод им. М. И. Калинина" 1984 / с. 90-94 : ил [https://www.ester.ee/record=b1238033\\*est](https://www.ester.ee/record=b1238033*est) <http://www.digar.ee/id/nlib-digar:887842>

#### **Численное моделирование силовых полупроводниковых приборов**

**Velmre, Enn** Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 49-64

#### **Численное моделирование статических неизотермических процессов в кремниевых силовых диодных и тиристорных структурах в открытом состоянии**

**Velmre, Enn; Udai, Andres; Freidin, Boris** Всесоюзный научно-технический семинар "Повышение параметров силовых полупроводниковых приборов на основе новых конструктивных решений и методов изготовления" (Запорожье, 1981) 1981 / с. 37-38

#### **Численное моделирование температурных распределений в кремниевых силовых полупроводниковых приборах при воздействии мощного импульса прямого тока**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris** Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ 1982 / с. 49-58 : ил [https://www.ester.ee/record=b1339926\\*est](https://www.ester.ee/record=b1339926*est) <https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search>

#### **Численное моделирование тиристора, управляемого полем**

**Velmre, Enn; Piroženko, Aleksander** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Kõide I 1989 / с. 153-156 : ил  
[https://www.ester.ee/record=b1272248\\*est](https://www.ester.ee/record=b1272248*est)

#### **Численное моделирование ударного режима кремниевых тиристорov**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boriss** Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 78-88 : ил

#### **Численное моделирование ударного режима силовых полупроводниковых приборов с учетом электронно-дырочного рассеяния**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 143-145 : ил [https://www.ester.ee/record=b1273986\\*est](https://www.ester.ee/record=b1273986*est)

#### **Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в стационарном режиме**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres** Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с. 88

#### **Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных полупроводников**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31 : ил [https://www.ester.ee/record=b1356516\\*est](https://www.ester.ee/record=b1356516*est)

#### **Численное моделирование эксперимента Шокли-Хейнса**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 49-53 : ил [https://www.ester.ee/record=b1591355\\*est](https://www.ester.ee/record=b1591355*est)

#### **Численное моделирование электротепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах с учетом электронно-дырочного рассеяния**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Seleninov, Kazimir; Freidin, Boris** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 185-188 : ил [https://www.ester.ee/record=b1264433\\*est](https://www.ester.ee/record=b1264433*est)

#### **Численное моделирование электрофизических процессов в полупроводниках с учетом электронно-дырочного рассеяния**

**Velmre, Enn; Piroženko, Aleksander; Udal, Andres** Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1985 / с. 66-71 [https://www.ester.ee/record=b1291241\\*est](https://www.ester.ee/record=b1291241*est)

#### **Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах**

**Aškinazi, German; Velmre, Enn; Kivi, U.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V.** Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 [https://www.ester.ee/record=b1304403\\*est](https://www.ester.ee/record=b1304403*est)

#### **Численный анализ одномерных полупроводниковых структур в стационарном режиме**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной дню радио и деятельности Эстонской организации НТОРЭС им. А. С. Попова за годы 1958-1978 1978 / с.32 [https://www.ester.ee/record=b1314631\\*est](https://www.ester.ee/record=b1314631*est)

#### **Численный анализ переходных процессов в диодных структурах на основе прямозонных полупроводников**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 26 [https://www.ester.ee/record=b1304403\\*est](https://www.ester.ee/record=b1304403*est)

#### **Численный расчет диода с точным учётом электронно-дырочного рассеяния**

**Velmre, Enn; Udal, Andres** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 39-43 [https://www.ester.ee/record=b1238033\\*est](https://www.ester.ee/record=b1238033*est)

#### **Экспериментальное исследование устойчивости широтно-импульсной системы второго рода**

**Velmre, Enn** Приборы и системы автоматики 1969 / с. 145-151 : илл [https://www.ester.ee/record=b1371445\\*est](https://www.ester.ee/record=b1371445*est)

#### **Электротехника и автоматика**

**Mägi, Harri; Velmre, Enn; Pikkov, Mihhail; Orro, S.; Rang, Toomas; Gurjanov, Boris; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman, Boriss; Keevallik, Andres; Kasirova, Lilia; Kruus, Margus; Ellervee, Peeter; Ubar, Raimund-Johannes; Grigorjeva, Ksenja; Kont, Toomas** 1989 [https://www.ester.ee/record=b1285446\\*est](https://www.ester.ee/record=b1285446*est)

#### **Электротехника и автоматика**

**Kukk, Vello; Tamm, Uljas; Pikkov, Otto; Min, Mart; Velmre, Enn; Udal, Andres; Nurste, Ivar; Freidin, Boris; Rang, Toomas; Opotski, Aleksei; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Järvalt, Aldur; Gurjanov, Boris; Lavrov, Mihhail; Belkina, I.I.; Plakk, Paul; Plakk, Peeter; Plakk, T.** 1987 [https://www.ester.ee/record=b1224910\\*est](https://www.ester.ee/record=b1224910*est)

#### **Электротехника и автоматика**

**Rüstern, Ennu; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman, Boriss; Tammemäe, Kalle; Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Štraube, B.; Elst, G.; Bombik, B.; Viies, Vladimir; Gallai, S.; Rang, Toomas; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Pikkov, Otto; Gurjanov, Boris; Opotski, Aleksei; Velmre, Enn** 1988 [https://www.ester.ee/record=b1256708\\*est](https://www.ester.ee/record=b1256708*est)

